

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

LABORATORIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

**AV. PLAYA PIE DE LA CUESTA No. EXT. 702, DESARROLLO SAN PABLO,
C.P. 76125, QUERÉTARO, MÉXICO**

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de
Eléctrica Electrónica*

Acreditación Número: EE-1739-083/24

Fecha de acreditación: 2024/01/22

Fecha de ampliación: 2024-12-05

No de referencia: 24LP3245

Tipo de tramite: Ampliación de alcance

Fecha de emisión: 2024-12-05

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

TELECOMUNICACIONES Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Prueba: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst (cláusulas 7.2.2 y 8, en el puerto de alimentación de equipos eléctricos y electrónicos monofásicos de hasta 220 V, 16 A).
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-4: 2012-04 Edition 3.0 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4:
Signatarios autorizados
Fernando Fonseca Navarro
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de México
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No de referencia: 24LP4908

Luis Felipe Martínez Soto
Yadian Pichardo González
Prueba: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase (cláusulas 6.1.3 y 8, para equipos eléctricos y electrónicos monofásicos de hasta 220 V).
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-11: 2020-01 Edition 3.0 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11
Signatarios autorizados
Fernando Fonseca Navarro
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Luis Felipe Martínez Soto
Yadian Pichardo González
Prueba: Testing and measurement techniques - surge immunity test (cláusulas 7.2 y 8, en el puerto de alimentación de equipos eléctricos y electrónicos monofásicos de hasta 220 V, 16 A).
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-5: 2017-08 Edition 3.1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5
Signatarios autorizados
Fernando Fonseca Navarro
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Luis Felipe Martínez Soto
Yadian Pichardo González
Prueba: Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas (cláusula 8)
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-2, edición 2.0, 2008-12
Signatarios autorizados
Fernando Fonseca Navarro
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Luis Felipe Martínez Soto
Yadian Pichardo González

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de México
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No de referencia: 24LP4908

Prueba: Prueba de inmunidad a ondas oscilatorias (cláusulas 7.2, 7.3 y 8)
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-12 Edición 3.0 2017-07
Signatarios autorizados
Fernando Fonseca Navarro
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Luis Felipe Martínez Soto
Yadian Pichardo González
Prueba: Procedimiento de pruebas recurrentes y pruebas después de reparación del equipo electromédico.
Norma y/o método de referencia: IEC 62353: 2014-09 edition 2.0 - Medical electrical equipment, Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment (cláusulas 5.2, 5.3 y 5.4 para equipos de 127 VAC hasta 16 A.
Signatarios autorizados
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Yadian Pichardo González
Prueba: Procedimiento de prueba de inmunidad al campo magnético de frecuencia de potencia nominal.
Norma y/o método de referencia: IEC 61000-4-8; ed 2.0: 2009 Inciso: 8, NMX-J-610-4-8-ANCE-2018 Inciso: 8. Electronic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test. Pruebas de inmunidad a los campos magnéticos a la frecuencia de suministro eléctrico.
Signatarios autorizados
J. Jesús Andrade Lugo
Jesús Licea Rangel
Yadian Pichardo González

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General